Влияние планарного магнитного поля на импульсное перемагничивание монокристаллических пленок (Bi,Lu)₃(Fe,Ga)₅O₁₂ с ориентацией (210)

© В.В. Рандошкин, А.М. Салецкий, Н.Н. Усманов, Д.Б. Чопорняк*

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

119992 Москва, Россия

* Научно-исследовательский институт ядерной физики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,

119992 Москва, Россия

E-mail: sam@rector.msu.ru

(Поступила в Редакцию 20 июня 2003 г.)

С помощью фотоотклика исследовано влияние планарного магнитного поля на процессы импульсного перемагничивания и релаксации в монокристаллических пленках (Bi,Lu) $_3$ (Fe,Ga) $_5$ O $_{12}$ с ориентацией (210). Конфигурация динамических доменных структур наблюдалась с помощью метода высокоскоростной фотографии.

Один из путей повышения быстродействия магнитооптичеких устройств состоит в использовании в них висмутсодержащих монокристаллических пленок ферритов-гранатов (Вс-МПФГ) с ромбической магнитной анизотропией [1]. В частности, высокая скорость доменных стенок ($\geq 300\,\text{m/s}$) наблюдалась в пленках (Bi,Lu) $_3$ (Fe,Ga) $_5$ O $_{12}$, выращенных на подложках Gd $_3$ Ga $_5$ O $_{12}$ с ориентацией (210) [2].

Целью настоящей работы является исследование влияния импульсного H_p и планарного $H_{\rm in}$ магнитных полей на процессы импульсного перемагничивания и релаксации Вс-МПФГ (Bi,Lu)₃(Fe,Ga)₅O₁₂ с ориентацией (210).

Исследования проводились на магнитооптической установке, позволяющей регистрировать процесс перемагничивания методом фотоотклика [3]. Излучение Не-Ne-лазера фокусировалось на поверхности образца в пятно диаметром 1 mm. Угол между осями пропускания поляризатора и анализатора выбирался таким, чтобы можно было наблюдать доменную структуру при амплитудном контрасте. Фотоприемником служил фотоумножитель типа ФЭУ-51. Сигнал с ФЭУ поступал на входы аналогово-цифрового преобразования и двухканального осциллографа.

Кроме того, формирующиеся в процессе импульсного перемагничивания динамические доменные структуры наблюдались методом высокоскоростной лазерной фотографии [4]. При этом источником подсветки служил импульсный лазер с длительностью импульса $10\,\mathrm{ns}$ и длиной волны излучения $\lambda=510\,\mathrm{nm}$.

Постоянное магнитное поле (поле смещения) H_b , направленное по нормали к пленке, создавалось с помощью катушки, внутрь которой помещался исследуемый образец. Импульсное магнитное поле, под действием которого происходило перемагничивание образца, прикладывалось в противоположном направлении. Это поле формировалось шестивитковой плоской катушкой с диаметром 2 mm. Длительности фронта и спада импульса

магнитного поля составляли 7 и 40 ns соответственно. Источник импульсов перемагничивающего поля синхронизировался с импульсом запуска лазера с помощью генератора импульсов типа Г5-67.

При большей амплитуде H_p перемагничивание происходило вследствие движения так называемой волны опрокидывания магнитных моментов [5–10], при меньшей — вследствие движения торцевой доменной стенки (ТДС) [11]. Эксперименты проводились в условиях, когда реализуется последний механизм. Заметим, что из-за неоднородности импульсного магнитного поля ТДС была не плоской, как в [12], а куполообразной, причем ее кривизна увеличивалась с ростом магнитного поля.

Планарное магнитное поле $H_{\rm in}$, направленное перпендикурярно проекции оси легкого намагничивания (ОЛН) на плоскость пленки, создавалось парой катушек Гельмгольца, в центре между которыми находился образец.

В работе приводятся данные для образца, ранее исследовавшегося в работах [3,11], со следующими параметрами: толщина пленки $h=11\,\mu$ m, угол наклона ОЛН $\theta=46^\circ$, намагниченность насыщения $4\pi M_s=43\,\mathrm{G}$, безразмерный параметр затухания Гильберта $\alpha\approx0.01$, константа одноосной магнитной анизотропии $K_u=1050\,\mathrm{erg/cm}^3$.

В исходном состоянии к образцу прикладывалось поле $H_b = 23$ Ое, которое превышало поле насыщения пленки $H_s = 17$ Ое и не изменялось в процессе экспериментов.

Безразмерный параметр затухания определялся по ширине линии ферромагнитного резонанса (ФМР). Сигнал ФМР содержал две интенсивные линии (что свидетельствует о слоистости Вс-МПФГ), а также ряд мод спин-волнового резонанса. К основному объему пленки относили наиболее интенсивную линию. Заметим, что из-за неоднородности пленки указанное значение α может быть завышенным. Значение $H_K - 4\pi M_s$ также определялось по данным ФМР исходя из величин резонансных полей при ориентации внешнего магнитного

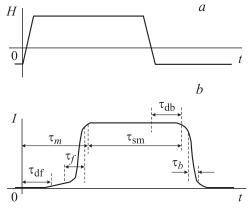


Рис. 1. Схематическое изображение перемагничивающего импульса (a) и сигнала фотоотклика (b). Показаны время задержки перемагничивания $\tau_{\rm df}$, длительность фронта сигнала фотоотклика τ_f , время перемагничивания τ_m , время задержки спада сигнала фотоотклика $\tau_{\rm db}$, время нахождения образца в намагниченном (монодоменном) состоянии $\tau_{\rm sm}$ и длительность спада сигнала фотоотклика τ_b .

поля перпендикулярно и параллельно плоскости пленки. Значение $4\pi M_s$ рассчитывалось на основании данных для поля коллапса цилиндрических магнитных доменов, при этом влиянием наклона ОЛН пренебрегалось.

На рис. 1 схематически изображены импульс перемагничивающего поля и сигнал фотоотклика. Сигнал фотоотклика характеризовался следующими параметрами: время задержки перемагнивчивания $\tau_{\rm df}$, длительность фронта τ_f , время перемагничивания τ_m , время задержки спада сигнала фотоотклика $\tau_{\rm db}$, длительность спада τ_b , время нахождения образца в намагниченном (монодоменном) состоянии $\tau_{\rm sm}$. Эти параметры определялись следующим образом: $\tau_{\rm df}$ — на уровне 0.05; τ_f , τ_b — на уровне 0.1—0.9; τ_m — на уровне 0.95; $\tau_{\rm sm}$ и $\tau_{\rm db}$ — на уровне 0.95 от амплитудного значения.

На рис. 2 показаны зависимости времени задержки начала размагничивания от планарного магнитного поля при фиксированной амплитуде $H_p=78$ Ое и разной его длительности. Видно, что зависимости $\tau_{\rm db}(H_{\rm in})$ несимметричны относительно оси ординат и на них присутствуют локальные максимумы. Минимальное значение времени задержки наблюдается при $\tau_p=1.10\,\mu{\rm s}$ (кривая 4 на рис. 2); оно увеличивается с ростом длительности импульса магнитного поля до $\sim 1.2\,\mu{\rm s}$ (кривая 4 на рис. 2). Максимальное значение времени задержки $\tau_{\rm db}\approx 2.0\,\mu{\rm s}$ практически на изменяется при варьировании длительности импульса в диапазоне от $1.10\,\mu{\rm s}$ (кривая I на рис. 2) до $30.0\,\mu{\rm s}$ (кривая I на рис. 2).

Для понимания физической природы появления максимумов на кривых $\tau_{\rm db}(H_{\rm in})$ (рис. 2) и несимметричности этих кривых требуется ответить на вопрос: разрушается ли полностью ТДС при достижении противоположной поверхности пленки во время действия импульса магнитного поля, или же ее "остатки" в каком-то виде сохраняются у этой поверхности после окончания этого

импульса? В первом случае с высокой вероятностью можно полагать: после окончания импульса магнитного поля реализуется тот же самый механизм перемагничивания, что и при его приложении, с той разницей, что действующее магнитное поле равно $-H_b$, а не $H_p - H_b$. Во втором случае задержку движения ТДС

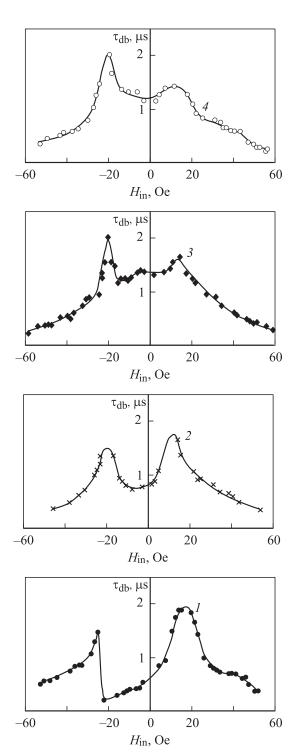


Рис. 2. Зависимости времени задержки начала размагничивания от планарного магнитного поля при амплитуде импульсного магнитного поля $H_p=78\,\mathrm{Oe}$ и разной его длительности. τ_p,μ s: $I=1.10,\,2=1.35,\,3=1.45,\,4=30.0$.

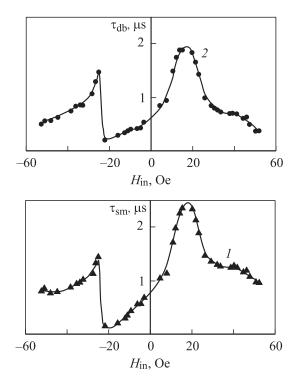


Рис. 3. Зависимости времени нахождения образца в намагниченном состоянии $au_{\rm sm}$ (I) и времени задержки начала размагничивания $au_{\rm db}$ (2) от планарного магнитного поля при амплитуде импульсного магнитного поля $H_p=78$ Ое и его длительности $au_p=1.10\,\mu{\rm s}$.

в обратном направлении можно связать с механизмами, обсуждаемыми в работах [13–18].

Несимметричность кривых $\tau_{\rm db}(H_{\rm in})$ (рис. 2) не является неожиданностью, поскольку она наблюдалась и при других эффектах [19–22] и может быть объяснена наличием планарной компоненты внутреннего эффективного магнитного поля [23].

На рис. З приведены зависимости времени задержки начала размагничивания и времени нахождения образца в намагниченном состоянии от планарного магнитного поля $H_{\rm in}$ при фиксированной амплитуде и минимальной длительности импульса магнитного поля, используемой в эксперименте. Видно, что кривые близки по форме, на них наблюдаются максимумы при обоих направлениях планарного магнитного поля, а время задержки начала размагничивания составляет основную часть времени нахождения образца в намагниченном состоянии.

На рис. 4 представлены зависимости времени задержки перемагничивания, длительности фронта сигнала фотоотклика, времени намагничивания и длительности спада сигнала фотоотклика от планарного магнитного поля $H_{\rm in}$ при той же самой амплитуде, что и для рис. 3, и максимальной длительности импульса магнитного поля, используемой в эксперименте ($\tau_p = 30.0\,\mu{\rm s}$).

При сравнении кривой I (рис. 4) и кривой 4 (рис. 2), а также кривых 2 и 4 (рис. 4) можно сделать вывод, что на фронте и спаде перемагничивающего импульса,

скорее всего, протекают аналогичные процессы. Тот факт, что локальные максимумы на кривой I (рис. 4) и кривой 4 (рис. 2) сильнее выражены, чем на кривых 2 и 4 (рис. 4), можно объяснить различием действующего

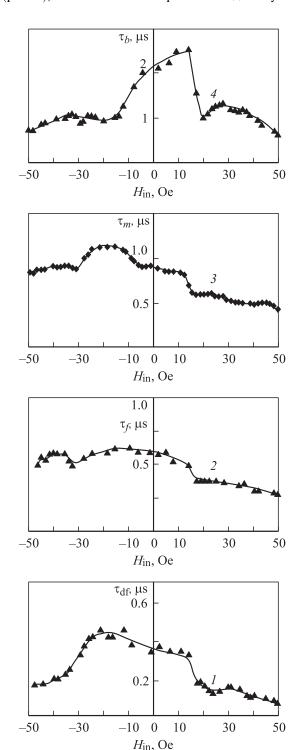


Рис. 4. Зависимости времени задержки начала перемагничивания $\tau_{\rm df}$ (1), длительности фронта сигнала фотоотклика τ_f (2), времени перемагничивания τ_m (3) и длительности спада сигнала фотоотклика τ_b (4) от планарного магнитного поля при амплитуде импульсного магнитного поля $H_p=78\,{\rm Oe}$ и его длительности $\tau_p=30\,\mu{\rm s}$.

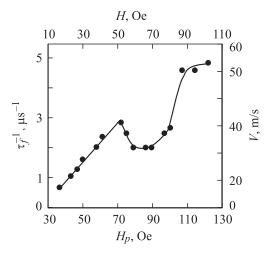


Рис. 5. Зависимость обратной величины длительности фронта сигнала фотоотклика τ_f^{-1} от амплитуды импульса магнитного поля H_P и действующего поля H.

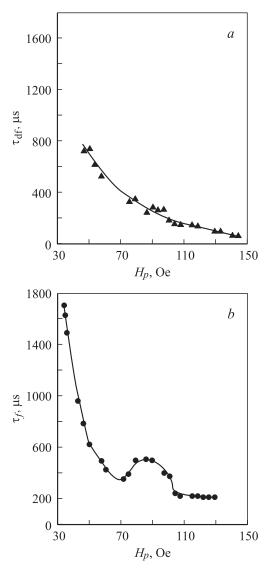


Рис. 6. Зависимости времени задержки перемагничивания $au_{
m df}(a)$ и длительности фронта сигнала фотоотклика $au_f(b)$ от амплитуды импульсного магнитного поля H_p .

магнитного поля (23 Ое в первом случае и 55 Ое во втором). Из рис. 4 видно, что для кривых $\tau_{\rm db}(H_{\rm in})$, $\tau_f(H_{\rm in})$ и $\tau_m(H_{\rm in})$ локальный максимум наблюдается при одном направлении планарного магнитного поля, а для кривой $\tau_b(H_{\rm in})$ — при противоположном.

На рис. 5 показана зависимость обратной величины длительности фронта сигнала фотоотклика от амплитуды импульса магнитного поля H_p и действующего магнитного поля $H = H_p - H_b$. Полагая, что длительность этого фронта обусловлена временем движения ТДС по толщине пленки, можно определить среднюю скорость ТДС

$$V \approx h/\tau_f$$
.

Шкала для V приведена на рис. 5. На первый взгляд начальный участок кривой V(H) (рис. 5) имеет вид, близкий к "классическому" для одноосных магнетиков с параметром затухания $\alpha < 1$ [24]: имеются начальный линейный участок, проходящий вблизи начала координат, и нелинейный участок с отрицательной дифференциальной подвижностью. Слишком высокое для Вс-МПФГ, не содержащих быстрорелаксирующих ионов, значение H_p , при котором заканчивается начальный линейный участок кривой V(H) (происходит срыв стационарного движения доменной стенки), объясняется возрастанием α при наличии внешнего или внутреннего эффективного магнитного поля в плоскости пленки [22,25-29]. Тот факт, что за нелинейным участком кривой V(H)следуют участок с дифференциальной подвижностью, превышающей начальную, и участок "насыщения", объясняется реализацией механизма движения доменной стенки, связанного с излучением спиновых волн, которые инициируют локальное вращение намагниченности перед движущейся стенкой [22,30,31].

То обстоятельство, что средняя скорость ТДС (рис. 5) примерно втрое меньше, чем ее скорость при прохождении середины пленки [11], может быть объяснено неравномерностью движения ТДС.

На рис. 6 показаны зависимости времени задержки перемагничивания и длительности фронта сигнала фотоотклика от амплитуды импульсного магнитного поля. Видно, что $\tau_{\rm df}$ монотонно снижается с ростом H_p (рис. 6, a), в то время как кривая $\tau_f(H_p)$ (рис. 6, b) является "перевернутой" кривой, показанной на рис. 5.

Таким образом, на основании данных, полученных в настощяей работе для Вс-МПФГ (Bi,Lu) $_3$ (Fe,Ga) $_5$ O $_{12}$ с ориентацией (210) при импульсном перемагничивании, можно сделать следующие выводы.

- 1) Перемагничивание пленки на фронте и спаде импульса магнитного поля осуществляется посредством общего маханизма.
- Время задержки перемагничивания монотонно уменьшается с ростом действующего магнитного поля.
- 3) В диапазоне действующих магнитных полей $H/4\pi M_s\approx 2$ перемагничивание пленок осуществляется посредством зарождения и движения ТДС.

- 4) На зависимостях времени задержки спада сигнала фотоотклика после окончания действия импульса магнитного поля и времени нахождения образца в намагниченном состоянии от планарного магнитного поля при обоих его направлениях наблюдаются максимумы.
- 5) Кривая зависимости скорости ТДС от действующего магнитного поля состоит из последовательно расположенных начального линейного участка, соответствующего стационарному движению ТДС; нелинейного участка, отвечающего нестационарному движению ТДС; участка с повышенной дифференциальной подвижностью и участка "насыщения", которые соответствуют движению ТДС с излучением спиновых волн.

Список литературы

- [1] В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. Прикладная магнито-оптика. Энергоатомиздат, М. (1990).
- [2] А.М. Балбашов, А.С. Логгинов, Е.П. Шабанов. ЖТФ 61, 6, 159 (1991).
- [3] В.В. Рандошкин, А.М. Салецкий, Н.Н. Усманов. ФТТ 44, 4, 717 (2002).
- [4] Н.Н. Усманов, Е.Н. Ильичева, А.Г. Шишков. Вестн. МГУ. Сер. 3. Физика, астрономия **36**, 74 (1995).
- [5] А.С. Логгинов, Г.С. Непокойчицкий. Письма в ЖЭТФ 35, 1, 22 (1982).
- [6] Л.П. Иванов, А.С. Логтинов, Г.С. Непокойчицкий. ЖЭТФ **84**, *3*, 1006 (1983).
- [7] Л.П. Иванов, Ф.В. Лисовский, А.С. Логгинов, Г.С. Непокойчицкий. Физика многочастичных систем 6, 75 (1984).
- [8] Н.Н. Куделькин, А.М. Прохоров, В.В. Рандошкин, В.Б. Сигачев, М.И. Тимошечкин. ДАН СССР 281, 4, 848 (1985).
- [9] М.В. Логунов, В.В. Рандошкин, В.Б. Сигачев. ФТТ 29, 8, 2247 (1987).
- [10] М.В. Логунов, В.В. Рандошкин. ФТТ 30, 2, 378 (1988).
- [11] В.В. Рандошкин, А.М. Салецкий, Н.Н. Усманов, Д.Б. Чопорняк. ФТТ **44**, *5*, 862 (2002).
- [12] А.П. Губарев, В.В. Рандошкин, В.Б. Сигачев, А.Я. Червоненкис. ЖТФ **55**, 7, 1393 (1985).
- [13] Р.В. Телеснин, А.М. Балбашов, А.Ф. Мартынов, В.В. Рандошкин, А.Я. Червоненкис. Письма в ЖЭТФ 7, 16, 1001 (1981).
- [14] S. Uba, A. Maziewski, J.J. Simsova. J. Phys. C: Solid State Phys. **16**, *12*, L383 (1983).
- [15] В.В. Осико, В.В. Рандошкин, В.Б. Сигачев, М.И. Тимошечкин. ЖТФ **54**, *12*, 2423 (1984).
- [16] A. Maziewski, M. Tekiela, P. Gornert. Acta Phys. Pol. 68, 1, 15 (1985).
- [17] M. Kisielewski, A. Maziewski, P. Gornert. J. Phys. D: Appl. Phys. 20, 2, 222 (1987).
- [18] В.В. Рандошкин, А.Ф. Мартынов, А.Я. Червоненкис. ФТТ **38**, *15*, 1592 (1996).
- 36, 13, 1392 (1990). [19] М.В. Логунов, В.В. Рандошкин. Письма в ЖТФ **12**, *1*, 28 (1986).
- [20] Ф.В. Лисовский, А.С. Логтинов, Г.С. Непокойчицкий, Т.В. Розанова. Письма в ЖЭТФ **45**, *7*, 339 (1987).
- [21] В.В. Рандошкин, Ю.Н. Сажин. ЖТФ 66, 8, 83 (1996).
- [22] В.В. Рандошкин. ФТТ 39, 8, 1421 (1997).
- [23] В.В. Рандошкин, В.А. Полежаев, Ю.Н. Сажин, Н.Н. Сысоев, В.Н. Дудоров. Письма в ЖТФ 28, 14, 38 (2002).

- [24] В.В. Рандошкин. ФТТ 37, 3, 652 (1995).
- [25] В.В. Рандошкин, В.Б. Сигачев, В.И. Чани, А.Я. Червоненкис. ФТТ 31, 7, 70 (1989).
- [26] М.В. Логунов, В.В. Рандошкин, Ю.Н. Сажин. ФТТ 32, 5, 1456 (1990).
- [27] В.В. Рандошкин, М.В. Логунов. ФТТ 36, 12, 3498 (1994).
- [28] В.В. Рандошкин. Письма в ЖТФ 21, 23, 64 (1995).
- [29] В.В. Рандошкин, А.М. Галкин, Ю.А. Дурасова, В.А. Полежаев, Ю.Н. Сажин, Н.Н. Сысоев. Вестн. МГУ. Сер. 3. Физика, астрономия 5, 62 (2002).
- [30] В.В. Рандошкин. ФТТ 37, 10, 3056 (1995).
- [31] В.В. Рандошкин. Изв. вузов. Физика 7, 9 (1997).